

백 윤 현, 김 정 섭, 배 상 든<sup>o</sup>, 구 본 재  
(인하 대)

Measurment of the negative ion mobility of  $SF_6$  gas

Y.H.Baek J.S. Kim S.D. Bae<sup>o</sup> B.J.Koo  
(Inha University)

## Abstract

In this paper, the negative ion mobility of  $SF_6$  is determined using as a negative ion detector the burst pulse which is triggered in a positive point-plane gap by electrons detached from negative ions near the anode point.

The result obtained for the negative ion mobility for zero field at atmospheric pressure is  $0.57 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ .

## 1. 서론

전기적 부성기체인  $SF_6$  중에서의 절연파괴 현장을 연구하는데 중요한 요소가 되는 음이온 이동도의 측정은 여러가지 실험 방법으로 행해졌지만 고압력하에서 측정한 경우는 극히 드물었다.

본 연구에서는 고압력 (대기압) 하에서 이동도 측정을 하기 위해 음이온 생성방법으로 자외선 퍌스를 사용했고 평행전극 사이의 평등전계중에서 음이온 이동의 관측은 정침대평판 전극 사이에서 앤오드 침전극으로 이동해온 음이온으로부터 이탈된 전자에 의해 일어나는 Burst 를 이용했다.

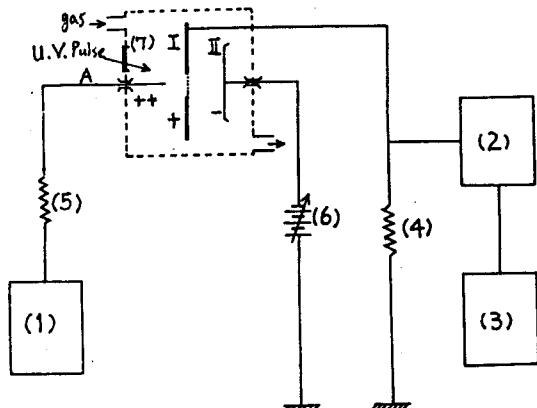
## 2. 실험장치 및 방법

이동도 측정에 사용되는 실험전극은 그림 1와 같이 3개로 구성된다.

한쌍의 평행평판전극중 중앙부가 망사구조로 된 전극 I 은 검출용 저항( $r$ )을 통해 접지되고 이에 대해 전극 II 은 부전위로 가변전원에 연결된다. 자외선 퍌스를 전극 I 의 전방에서 그물망 부분만 조사하면 전극 I 의 그물망과 전극 II 의 표면에서 방출된 광전자는 부근의  $SF_6$  기체에 부착하여 음이온을 형성한다.

전극 II의 표면부근에서 생긴 음이온(II) 군은 전극 I 의 그물망을 향해 이동하고 있는 동안 전극 I 의 그물망에

서 생긴 음이온(I) 군은 침전극 A 를 향해 검출공간을 이동하여 침전극 부근에서 해피되어 Burst 를 발생시키고 이 Burst는 방전저지용 저항( $R$ ) 때문에 계속되지 못한다.



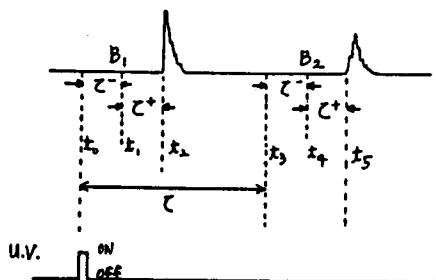
전극 A 의 곡률반경  $0.4 \text{ mm}$ , 전극 I 의 막사인 중앙부직경  $7 \text{ mm}$ , 구동공간(전극 I - 전극 II)의 간격  $8 \text{ mm}$ , 검출공간 (침전 A - 전극 I)의 간격  $17 \text{ mm}$ ,

- (1) 고전압 안정화 전원, (2) Pre-Amplifier,
- (3) Oscilloscope, (4) 검출용 저항( $r$ ):  $500 \text{ k}\Omega$ , (5) 방전저지용 저항( $R$ ):  $100 \text{ M}\Omega$
- (6) 가변전원, (7) 수정장치

## 그림1. 실험장치의 개략도

이때 생긴 정이온은 전극 I로 이동하여 전극 I 에 연결된 검출용 저항( $r$ )에 전압 강하로 나타난다.

그 다음에 그물망을 통과한 이온(II)군이 같은 방법으로 겹출공간을 이동 Burst 와 전압강화를 일으킨다. 겹출용 저항에 연결된 Osci.에는 그림2와 같은 두 개의 퍼스가 조사후에 나타난다.



$t_0$  : 자외선 퍼스조사     $t_1$  : Burst<sub>1</sub> 발생  
 $t_2$  : 전압강화<sub>1</sub>     $t_3$  : 전극 I에 음이온(II)군 도착  
 $t_4$  : Burst<sub>2</sub> 발생     $t_5$  : 전압강화<sub>2</sub>

그림2. Osci.에 나타난 전압강화 패형

즉  $t_0$ 에 자외선 퍼스를 조사후 이온(I)군에 의해 겹출공간의 비행시간( $\tau$ ) 경과후  $t_1$ 에 Burst<sub>1</sub> 나마나고 이때 생긴 정이온에 의해 겹출공간의 비행시간( $\tau$ ) 후  $t_2$ 에 전압강화가 나타난다. 이온(II) 군은 구동공간의 비행시간( $\tau$ ) 와  $\tau$  을 합한  $t_4$ 에서 Burst<sub>2</sub> 을 일으키고  $\tau$  후  $t_5$ 에서 전압강화가 나타난다. 그 뿐만 아니라 두 개의 퍼스사이의 시간차( $\tau$ )가 음이온이 구동공간을 이동하는데 소요된 시간에 해당하므로 다음과 같은 식으로 표현된다.

$$U = d(E\tau)^{-1}$$

여기서  $d$  와  $E$  는 각각 구동공간에서의 극간거리와 전계의 세기이다.

#### 실험조건

- 10 < 침전극전압 < 12 kV
- 압력 766 Torr
- 0.018 < E/P < 1.2 Vcm<sup>-1</sup>Torr<sup>-1</sup>

#### 3. 실험결과

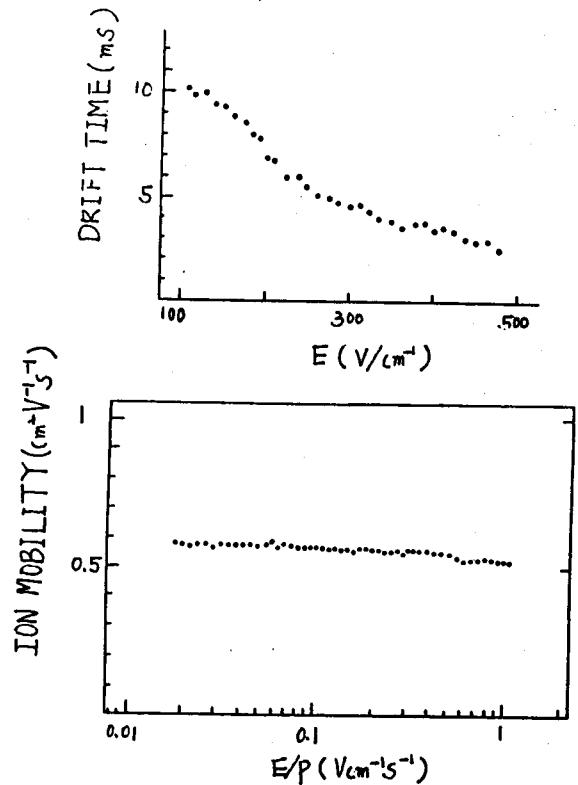


그림3. 실험결과

#### 4. 결론

환산이동도는  $0.57 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$  을 얻었고, 구동공간의 E/P (<1.2Vcm<sup>-1</sup>Torr<sup>-1</sup>) 가 낮으므로 이 값은 SF<sub>6</sub> (<60Vcm<sup>-1</sup>Torr<sup>-1</sup>) 이다. 측정기체가 부수기체로 전환되고 정이온에 대해 측정할 수 없는 단점이 있지만 측정시의 압력을 고압으로 할 수 있으며 이동도 결정 변수가 적기 때문에 다른 실험방법에 비해 손쉽게 산출할 수 있는 장점이 있다.

#### 5. 참고문헌

- M.N.Hirsh, H.J.Oskam, Gaseous electronics (Academic press, 1978), Chap.4.
- L.G. Christophorou, Gaseous dielectrics II (Pergamon press, 1980), PP.1-53.
- E.W.McDaniel, Ion-molecule reactions (John Wiley and sons, 1970), Chap.2.
- J.M.Meek, J.D.Craggs, Electrical breakdown of gases (John Wiley and sons, 1978), Chap.4.
- E.W. McDaniel, E.A.Mason, The mobility and diffusion of ions in gases (John Wiley and sons, 1973), Chap. 1,2,3.
- I.A. Fleming, J.A. Rees, J.Phys. B.2,777 (1969)

- J.P. McGeehan, B.C.O'neill, A.N.Prasad, J.D.  
Craggs, J.Phys. D.8, 153(1975)
- A.J. Ahearn, N.B.Hannay, J.Chem Phys.21,  
119 (1953)
- Jde Urquijo-Carmona, J.Phys D.16, 1603(1983).